

Patent 258/113



TRADEWART N THE UNITED	STATES PATEN	IT AND TRAD	EMARK OFFICE
In re the Application of:) Group Art Unit: 2612	
S. Shinotsuka et al.) Examiner: N/A	
Serial No.: 09/710,196)	
Filed: November 10, 2000)	
For: PHOTO-SENSOR CIRCUIT AND OPERATING METHOD)))	
TRANSMITTAL C	OF PRIORITY DO	CUMENT UNI	DER 37 CFR 1.119
Box NO FEE Assistant Commissioner for F Washington, D.C. 20231	atents	,	
Sir:			
Applicant hereb	y claim the right o	of priority under	r 35 USC §119 based on the
following patent application:			
Application No.	Country		Filing Date
11-359622	Japan		November 12, 1999
	CERTIFICATE (37 C.F.R		
I hereby certify that this paper (along v United States Postal Service on the dat addressed to the Assistant Commission	vith any referred to as be e shown below with su	peing attached or en fficient postage as l gton, D.C. 20231.	First Class Mail in an envelope
	Saundra Name of		L. Carr Person Mailing Paper
4-27-01		Sound	on Alary
Date of Deposit			e of Person Mailing Paper



Attached hereto is the certified copy of the patent application from which

priority is being claimed.

Respectfully submitted,

LYON & LYON LLP

By:

Conrad R. Solum, Jr

Reg. No. 20,467

633 West Fifth Street, Suite 4700 Los Angeles, California 90071-2066 (213) 489-1600



日本国特許庁 PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年11月12日

出願番号

Application Number:

平成11年特許願第359622号

出 願 人 Applicant (s):

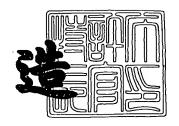
本田技研工業株式会社

2001年 1月 5日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office



川耕



【書類名】 特許願

【整理番号】 E99-300

【提出日】 平成11年11月12日

【あて先】 特許庁長官殿

【請求項の数】 3

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市新狭山1丁目10番地1 ホンダエンジニ

アリング株式会社内

【氏名】 篠塚 典之

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市新狭山1丁目10番地1 ホンダエンジニ

アリング株式会社内

【氏名】 武部 克彦

【特許出願人】

【識別番号】 000005326

【住所又は居所】 東京都港区南青山二丁目1番1号

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【代表者】 吉野 浩行

【代理人】

【識別番号】 100077746

【住所又は居所】 神奈川県横浜市中区弁天通り2丁目25番地 関内キャ

ピタルビル6F

【弁理士】

【氏名又は名称】 鳥井 清

【電話番号】 045-201-7858

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9806413

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光センサ回路

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光信号を検知して電気信号に変換する光センサ素子(PD)と、その光センサ素子の寄生容量(C1)の電荷を充放電するための第1のMO S型トランジスタ(Q1)と、前記光センサ素子の端子電圧を画素信号として蓄積するためのコンデンサ(C2)と、前記光センサ素子の寄生容量の電荷をそのコンデンサへ転送するための第2のMO S型トランジスタ(Q2)と、前記コンデンサの端子電圧を増幅するための第3のMO S型トランジスタ(Q3)と、その増幅された画素信号を選択的に出力させる第4のMO S型トランジスタ(Q4)とからなり、画素信号を蓄積する前に一定時間第1のMO S型トランジスタと第2のMO S型トランジスタとをオンにして、前記光センサ素子の寄生容量と前記コンデンサとの充放電を行って両者の端子電圧を同じにしたのち、一定の蓄積時間の経過後に第2のMO S型トランジスタをオフにして前記コンデンサをオープン状態としたうえで、第4のMO S型トランジスタをオンにするようにしたことを特徴とする光センサ回路。

【請求項2】 光信号を検知して電気信号に変換する光センサ素子(PD)と、その光センサ素子のセンサ電流を弱反転状態で対数特性を有するセンサ電圧に変換する第1のMOS型トランジスタと、光信号の検出時にその第1のMOS型トランジスタのドレイン電圧を所定時間だけ低い電圧に設定してソースに接続された前記光センサ素子の寄生容量(C1)に蓄積された電荷の充電を制御する初期設定手段と、前記光センサ素子の端子電圧を画素信号として蓄積するためのコンデンサ(C2)と、前記光センサ素子の寄生容量の電荷をそのコンデンサへ転送するための第2のMOS型トランジスタ(Q2)と、前記コンデンサの端子電圧を増幅するための第3のMOS型トランジスタ(Q3)と、その増幅された画素信号を選択的に出力させる第4のMOS型トランジスタ(Q4)とからなり、画素信号を蓄積する前に第2のMOS型トランジスタをオンにするとともに、初期設定手段の電圧をローレベル状態として前記光センサ素子の寄生容量と前記コンデンサの端子電圧をローレベル状とし、一定時間の経過後に初期設定手段の

電圧をハイレベル状態に切り換えて画素信号の蓄積を開始させたのち、一定の蓄積時間の経過後に第2のMOS型トランジスタをオフにして前記コンデンサをオープン状態としたうえで、第4のMOS型トランジスタをオンにするようにしたことを特徴とする光センサ回路。

【請求項3】 イメージセンサの1画素分の構成要素とするようにしたことを特徴とする請求項1または請求項2の記載による光センサ回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本発明は、光信号を検知して電気信号に変換する、特にシャッタ機能を有する光センサ回路に関する。

[0002]

【従来の技術】

イメージセンサの1画素分の構成要素となるシャッタ機能(サンプルアンドホールド機能)を有する光センサ回路としては、図1に示すように、光信号を検知して電気信号に変換する光センサ素子としてのフォトダイオードPDと、そのフォトダイオードPDの寄生容量であるコンデンサC1の電荷を充放電するためのMOS型トランジスタQ1と、フォトダイオードPDの端子電圧を画素信号として蓄積するためのコンデンサC2と、コンデンサC1の電荷をコンデンサC2へ転送するためのMOS型トランジスタQ2と、コンデンサC2の端子電圧を増幅するためのMOS型トランジスタQ3と、その増幅された画素信号を選択的に出力させるMOS型トランジスタQ4とからなっている。

[0003]

このように構成された光センサ回路において、従来では、図9に示すような各 部信号のタイミングをもって動作させるようにしている。

[0004]

すなわち、タイミングt1~t2において駆動電圧V1をハイレベルにすることによってトランジスタQ1をオン状態にし、フォトダイオードPDの寄生容量であるコンデンサC1に電荷を充電する。そして、タイミングt2~t3におい

て、コンデンサC1に充電された電荷は、フォトダイオードPDに光が入射する ことによって流れるセンサ電流に比例した電荷が放電される。

[0005]

次に、タイミングt 3~t 4 においてトランジスタQ 2 をオンにして、コンデンサC 1 の電荷をコンデンサC 2 に転送する。そして、タイミングt 4~t 5 においてトランジスタQ 4 をオンにすると、トランジスタQ 3 によって制限されるが電源 V 5 から電流が供給されて、抵抗 R を介して画素信号が V o u t として出力される。

[0006]

なお、この光センサ回路の構成にあっては、タイミング t 4 以後にトランジスタQ 2 がオフ状態になるとコンデンサC 2 の電荷が保持されることになり、次にシランジスタQ 2 をオンにすることによってコンデンサC 1 の電荷をコンデンサC 2 に転送するまではコンデンサC 2 の電荷は一定となる。つまり、トランジスタQ 2 がオフの期間(コンデンサC 2 の保持期間)は、コンデンサC 1 の端子電圧V c 1 が変化しても画素信号としては同じ出力が得られることになる。

[0007]

以上のような光センサ回路とすることによって、画素単位でシャッタ機能をも たせることが可能となるため、シャッタの開放時間の制御などが可能になる。

[0008]

また、図10はシャッタ機能を有する光センサ回路の他の構成を示しており、 ここでは特に、コンデンサC2の電荷を充放電するためのMOS型トランジスタ Q5が設けられている。

[0009]

そして、このように構成された光センサ回路にあっても、前述の場合と同様に動作するが、この場合は特に、図11に示すように、タイミング t 6~ t 7 においてトランジスタQ5をオンにすると、コンデンサC2の電荷が放電されて画素信号が初期化されるようになっている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

図1に示すように構成された光センサ回路では、トランジスタQ2の働きによってコンデンサC1の端子電圧Vc1をコンデンサC2に転送できるが、コンデンサC2の電荷は次にトランジスタQ2がオンになるまで保持されている。したがって、コンデンサC1の端子電圧Vc1とコンデンサC2の端子電圧Vc2が異なる場合は、トランジスタQ2がオンとなる前のコンデンサC1の端子電圧Vc1がコンデンサC2に正確に反映されず、再現性が悪いという問題がある。

[0011]

光信号の検知を連続して行わせたときのコンデンサC1およびコンデンサC2 に蓄積される電荷の状態を、図12にモデル的に示している。

[0012]

また、図10に示すように構成された光センサ回路では、コンデンサC2の電荷がトランジスタQ5によって充放電可能なため、コンデンサC1の端子電圧Vc1は再現性良くコンデンサC2に転送されるが、コンデンサC2の信号分はコンデンサC1の信号分より小さくなってしまうという問題がある。

[0013]

そのときのコンデンサC1およびコンデンサC2に蓄積される電荷の状態を、 図13にモデル的に示している。

[0014]

【課題を解決するための手段】

本発明は、図1に示す光センサ回路にあって、コンデンサC2の電圧再現性を防止するべく、トランジスタQ1をオンにしてフォトダイオードPDの寄生容量であるコンデンサC1の充放電を行わせるに際して、トランジスタQ2をオンにしてコンデンサC2の充電状態を初期化するようにしている。

[0015]

また、本発明は、コンデンサC2の電圧低下を防止するべく、シャッタが開放 状態となる期間中は、サンプルアンドホールド用のトランジスタQ2をオンにし て、コンデンサC1の端子電圧Vc1がコンデンサC2に常時伝達されるように している。

[0016]

そして、本発明では、ダイナミックレンジが広く、かつ再現性良く画素信号が得られるようにするべく、シャッタ機能に加えて電源電圧V2を切り換えることによる対数動作を行わせる初期設定手段をとるようにしている。

[0017]

【実施例】

本発明に係る光センサ回路は、図1に示すように、光信号を検知して電気信号に変換する光センサ素子としてのフォトダイオードPDと、そのフォトダイオードPDの寄生容量であるコンデンサC1の電荷を充放電するためのMOS型トランジスタQ1と、フォトダイオードPDの端子電圧を画素信号として蓄積するためのコンデンサC2と、コンデンサC1の電荷をコンデンサC2へ転送するためのMOS型トランジスタQ2と、コンデンサC2の端子電圧を増幅するためのMOS型トランジスタQ3と、その増幅された画素信号を選択的に出力させるMOS型トランジスタQ4とによって構成されている。

[0018]

このように構成された光センサ回路において、本発明では、特に、図2に示すように、各部駆動の制御信号を与えることにより、光信号に応じた電気信号が得られるようにしている。

[0019]

すなわち、タイミングt1~t2において駆動電圧V1をハイレベルにすることによってトランジスタQ1をオン状態にし、フォトダイオードPDの寄生容量であるコンデンサC1に電荷を充電する。そして、タイミングt2~t3において、コンデンサC1に充電された電荷は、フォトダイオードPDに光が入射することによって流れるセンサ電流に比例した電荷が放電される。

[0020]

この間のタイミング t $1 \sim t$ 3 (シャッタ開放期間) ではトランジスタQ 2 もオン状態になっており、コンデンサC 1 の端子電圧V c 1 とコンデンサC 2 の端子電圧V c 1 とコンデンサC 2 の端子電圧V c 1 とが同一になっている。

[0021]

そして、タイミング t 3 におけるトランジスタQ 2 のオフによってコンデンサ

C2の端子電圧Vc2は保持状態になる。

[0022]

次に、タイミングt4~t5においてトランジスタQ4をオンにすると、トランジスタQ3によって制限されるが電源V5から電流が供給されて、抵抗Rを介して画素信号がVoutとして出力される。

[0023]

なお、この光センサ回路の構成にあっては、タイミングt3以後にトランジスタQ2がオフ状態になるとコンデンサC2の電荷が保持されることになり、次にトランジスタQ2をオンにすることによってコンデンサC1の電荷をコンデンサC2に転送するまではコンデンサC2の電荷は一定となる。つまり、トランジスタQ2がオフの期間(コンデンサC2の保持期間)は、コンデンサC1の端子電圧Vc1が変化しても画素信号としては同じ出力が得られることになる。

[0024]

したがって、図1に示す光センサ回路を図2に示すように動作させることによって、4トランジスタ構成でありながら再現性の良い画素信号Voutを得ることができるようになる。

[0025]

また、図3は本発明による光センサ回路の他の実施例を示している。

[0026]

この実施例では、特に、MOS型トランジスタQ1'として、フォトダイオードPDのセンサ電流を弱反転状態で対数特性をもって検出電圧に変換するものを用いるようにしている。そして、そのトランジスタQ1'のドレイン側の電源電圧V2を所定時間だけ定常値(ハイレベル)よりも低い電圧値(ローレベル)に設定して、ソース側に接続されたフォトダイオードPDの寄生容量であるコンデンサC1に蓄積された電荷を放電させて初期化する電圧コントローラ1(初期設定手段)を設けるようにしている。

[0027]

このように構成された光センサ回路の動作について、図4に示す各部信号のタ イムチャートとともに、以下説明をする。 [0028]

電源電圧V1は、トランジスタQ1'に流れる電流が電源電圧V2をハイレベル状態としたときに弱反転状態で対数特性を有する検出電圧に変換される電圧値に設定されている。

[0029]

この状態において、タイミングt1~t2において駆動電圧V2をローレベルにすると、トランジスタQ1′のドレイン・ソース間の電圧が大きくなることからトランジスタQ1′はオン状態となり、フォトダイオードPDの寄生容量であるコンデンサC1に電荷を放電させる。

[0030]

次に、t2の時点で駆動電圧V2がハイレベルに切り換わり、タイミングt2 ~t3において、フォトダイオードPDに流れるセンサ電流とトランジスタQ1 'から供給される電流がつり合うような電圧でコンデンサC1に電荷が充電される。

[0031]

このとき、トランジスタQ1'に流れる電流は弱反転状態で対数特性を有する 検出電圧に変換されているため、コンデンサC1の端子電圧Vc1はフォトダイ オードPDに入射した光量を対数変換出力したものとなる。

[0032]

その間のタイミング t $1 \sim t$ 3 (シャッタ開放期間) ではトランジスタQ 2 もオン状態になっており、コンデンサC 1 の端子電圧 V c 1 とコンデンサC 2 の端子電圧 V c 1 とことは同一になっている。

[0033]

そして、タイミング t 3 におけるトランジスタQ 2 のオフによってコンデンサ C 2 の端子電圧 V c 2 は保持状態になる。

[0034]

[0035]

なお、この光センサ回路の構成にあっては、タイミング t 3 以後にトランジスタ Q 2 がオフ状態になるとコンデンサ C 2 の電荷が保持されることになり、次にシランジスタ Q 2 をオンにすることによってコンデンサ C 1 の電荷をコンデンサ C 2 に転送するまではコンデンサ C 2 の電荷は一定となる。つまり、トランジスタ Q 2 がオフの期間(コンデンサ C 2 の保持期間)は、コンデンサ C 1 の電圧が変化しても画素信号としては同じ出力が得られることになる。

[0036]

したがって、図3に示す光センサ回路を図4に示すように動作させることによって、残像の影響がなく、かつダイナミックレンジの広い対数出力を有するシャッタ機能を実現できるようになる。

[0037]

以上説明した本発明による光センサ回路を1画素分の構成要素として、それを 一次元または二次元状に配設することによってイメージセンサを構成することが できるようになる。

[0038]

図5は、図1に示す光センサ回路を1画素として二次元のマトリクス状に配設したときのイメージセンサの構成例を示している。図中、2は各画素Sに共通に設けられた画素選択回路であり、3は各画素Sの画素信号を順次出力させるための信号選択回路である。

[0039]

図6は、このような構成によるイメージセンサの各部信号のタイムチャートを 示している。

[0040]

この場合には、特に、タイミングt4~t5において、マトリクス状に配された各画素Sの読出し走査が行われる。その際、各画素Sとしての光センサ回路におけるトランジスタQ4をオンにすると、トランジスタQ3によって制限されるが電源V5から電流が各画素に供給され、各画素Sの行に接続された抵抗Rを介して画素信号Voutとして出力されることになる。

[0041]

したがって、このような構成によれば、4トランジスタ構成でありながら再現 性の良い画素信号Voutが得られるようになる。

[0042]

図7は、図3に示す光センサ回路を1画素として二次元のマトリクス状に配設したときのイメージセンサの構成例を示している。図中、1は各画素Sに共通に設けられた電圧コントローラであり、2は各画素Sに共通に設けられた画素選択回路であり、3は各画素Sの画素信号を順次出力させるための信号選択回路である。

[0043]

図8は、このような構成によるイメージセンサの各部信号のタイムチャートを 示している。

[0044]

この場合にあっても、前述の場合と同様に、タイミングt4~t5においてマトリクス状に配された各画素Sの読出し走査が行われる。

[0045]

なお、図6および図8に示すタイムチャートにあって、蓄積時間すなわち電源 電圧V3がハイレベルになっているシャッタ開放期間をt4の時点まで長く設定 することが可能である。

[0046]

【発明の効果】

以上、本発明は、光信号を検知して電気信号に変換する光センサ素子(PD)と、その光センサ素子の寄生容量(C1)の電荷を充放電するための第1のMO S型トランジスタ(Q1)と、前記光センサ素子の端子電圧を画素信号として蓄積するためのコンデンサ(C2)と、前記光センサ素子の寄生容量の電荷をそのコンデンサへ転送するための第2のMOS型トランジスタ(Q2)と、前記コンデンサの端子電圧を増幅するための第3のMOS型トランジスタ(Q3)と、その増幅された画素信号を選択的に出力させる第4のMOS型トランジスタ(Q4)とからなる光センサ回路にあって、、画素信号を蓄積する前に一定時間第1の

MOS型トランジスタと第2のMOS型トランジスタとをオンにして、前記光センサ素子の寄生容量と前記コンデンサとの充放電を行って両者の端子電圧を同じにしたのち、一定の蓄積時間の経過後に第2のMOS型トランジスタをオフにして前記コンデンサをオープン状態としたうえで、第4のMOS型トランジスタをオンにするようにしたもので、再現性の良い画素信号を得ることができるという利点を有している。

[0047]

また、本発明は、光信号を検知して電気信号に変換する光センサ素子(PD) と、その光センサ素子のセンサ電流を弱反転状態で対数特性を有するセンサ電圧 に変換する第1のMOS型トランジスタと、光信号の検出時にその第1のMOS 型トランジスタのドレイン電圧を所定時間だけ低い電圧に設定してソースに接続 された前記光センサ素子の寄生容量(C1)に蓄積された電荷の充電を制御する 初期設定手段と、前記光センサ素子の端子電圧を画素信号として蓄積するための コンデンサ(C2)と、前記光センサ素子の寄生容量の電荷をそのコンデンサへ 転送するための第2のMOS型トランジスタ(Q2)と、前記コンデンサの端子 電圧を増幅するための第3のMOS型トランジスタ(Q3)と、その増幅された 画素信号を選択的に出力させる第4のMOS型トランジスタ(Q4)とからなる 光センサ回路にあって、画素信号を蓄積する前に第2のMOS型トランジスタを オンにするとともに、初期設定手段の電圧をローレベル状態として前記光センサ 素子の寄生容量と前記コンデンサの端子電圧をローレベル状とし、一定時間の経 過後に初期設定手段の電圧をハイレベル状態に切り換えて画素信号の蓄積を開始 させたのち、一定の蓄積時間の経過後に第2のMOS型トランジスタをオフにし て前記コンデンサをオープン状態としたうえで、第4のMOS型トランジスタを オンにするようにしたもので、残像の影響がなく、かつダイナミックレンジの広 い対数出力を有するシャッタ機能を実現できて、再現性の良い画素信号を得るこ とができるという利点を有している。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明による光センサ回路の一実施例を示す電気回路図である。

【図2】

その一実施例における光センサ回路の各部信号のタイムチャートである。

【図3】

本発明による光センサ回路の他の実施例を示す電気回路図である。

【図4】

その他の実施例における光センサ回路の各部信号のタイムチャートである。

【図5】

本発明による光センサ回路を1画素として二次元のマトリクス状に配設したと きのイメージセンサの一構成例を示すブロック図である。

【図6】

その一構成例におけるイメージセンサの各部信号のタイムチャートである。

【図7】

本発明による光センサ回路を1画素として二次元のマトリクス状に配設したと きのイメージセンサの他の構成例を示すブロック図である。

【図8】

その他の構成例におけるイメージセンサの各部信号のタイムチャートである。

【図9】

図1に示す光センサ回路を従来のように動作させたときの各部信号のタイムチャートである。

【図10】

従来のシャッタ機能を有する光センサ回路の構成例を示す電気回路図である。

【図11】

その従来の光センサ回路の動作時における各部信号のタイムチャートである。

【図12】

図1に示す光センサ回路を従来のように動作させたときのコンデンサC1およびコンデンサC2に蓄積される電荷の状態をモデル的に示す図である。

【図13】

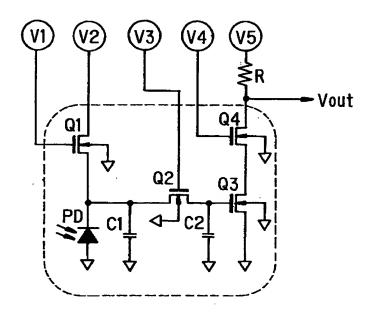
図10に示す光センサ回路を従来のように動作させたときのコンデンサC1およびコンデンサC2に蓄積される電荷の状態をモデル的に示す図である。

【符号の説明】

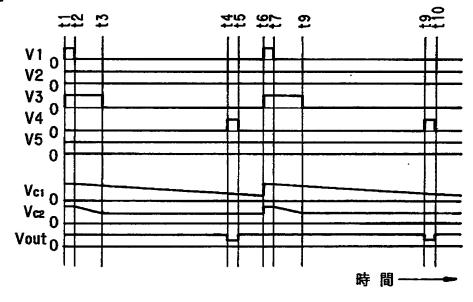
- 1 電圧コントローラ (初期設定手段)
- 2 画素選択回路
- 3 信号選択回路

【書類名】 図面

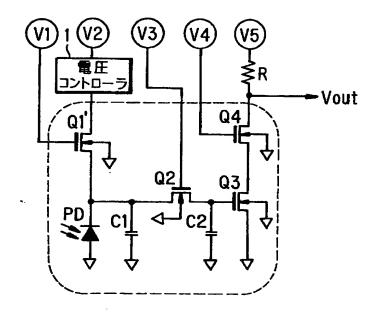
【図1】



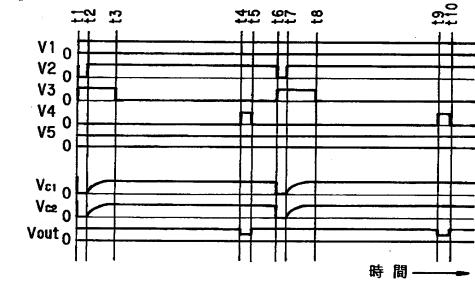
【図2】



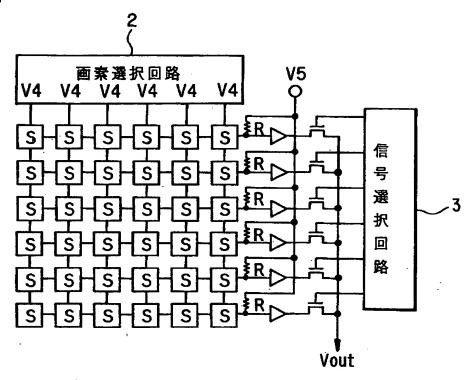
[図3]



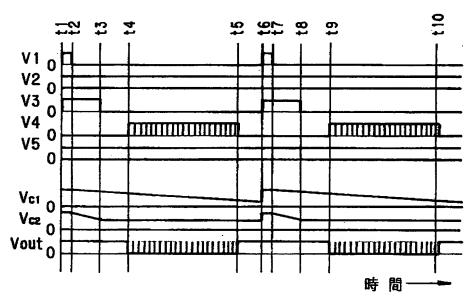


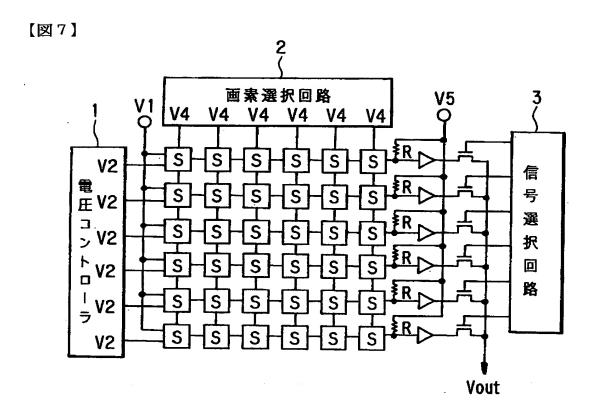


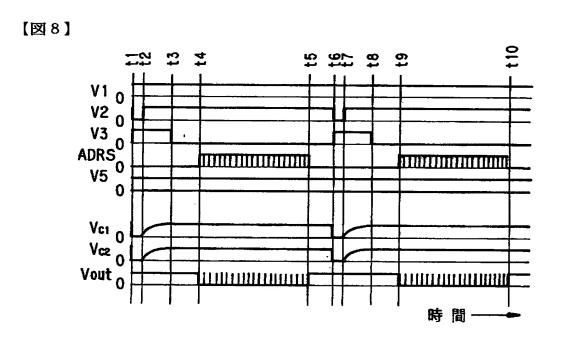
【図5】



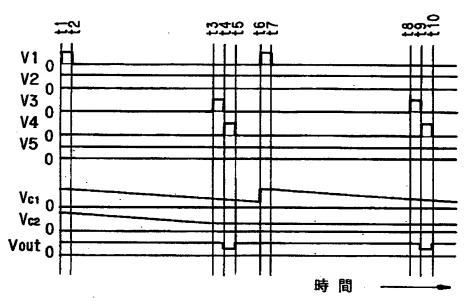
【図6】



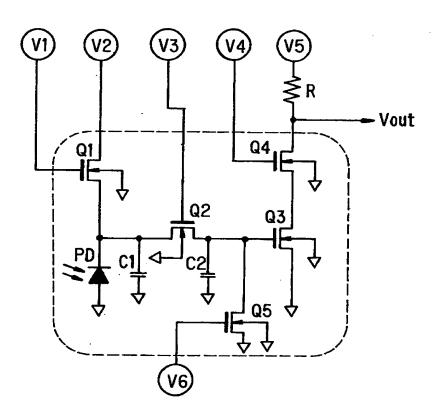




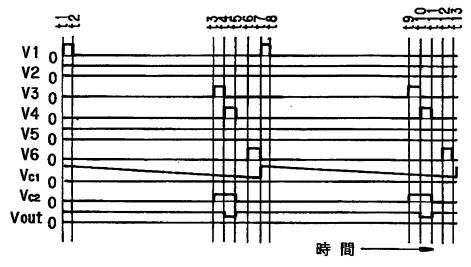




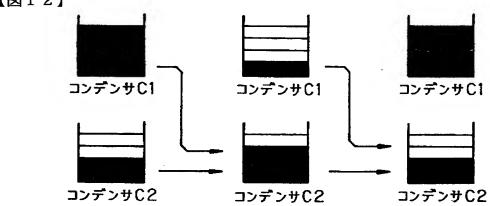
【図10】



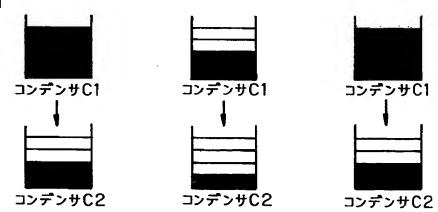




【図12】



【図13】



6

【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 シャッタ機能を有する光センサ回路にあって、再現性の良い画素信号 を得ることができるようにする。

【構成】 光信号を検知して電気信号に変換する光センサ素子(PD)と、その光センサ素子の寄生容量(C1)の電荷を充放電するための第1のMOS型トランジスタ(Q1)と、前記光センサ素子の端子電圧を画素信号として蓄積するためのコンデンサ(C2)と、前記光センサ素子の寄生容量の電荷をそのコンデンサへ転送するための第2のMOS型トランジスタ(Q2)と、前記コンデンサの端子電圧を増幅するための第3のMOS型トランジスタ(Q3)と、その増幅された画素信号を選択的に出力させる第4のMOS型トランジスタ(Q4)とからなり、画素信号を蓄積する前に一定時間第1のトランジスタと第2のトランジスタとをオンにして、前記光センサ素子の寄生容量と前記コンデンサとの充放電を行って両者の端子電圧を同じにしたのち、一定の蓄積時間の経過後に第2のトランジスタをオンにして前記コンデンサをオープン状態としたうえで、第4のトランジスタをオンにするように構成する。

【選択図】 図1

職権訂正履歴 (職権訂正)

特許出願の番号

平成11年 特許願 第359622号

受付番号

29921500230

書類名

特許願

担当官

角田 芳生

1918

作成日

平成12年 1月13日

<訂正内容1>

訂正ドキュメント

明細書

訂正原因

職権による訂正

訂正メモ

【特許請求の範囲】の項目がないので加入します。

訂正前内容

【発明の名称】 光センサ回路

【請求項1】

訂正後内容

【発明の名称】 光センサ回路

【特許請求の範囲】

【請求項1】

出願人履歴情報

識別番号

[000005326]

1. 変更年月日 1990年 9月 6日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目1番1号

氏 名

本田技研工業株式会社